

## ВЕРХНЯЯ ЗОНА ХАББАРДА И ПРОВОДИМОСТЬ ПО ПРИМЕСЯМ НЕКОМПЕНСИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

Гершензон Е. М., Гурвич Ю. А., Мельников А. П., Шестаков Л. Н.

Обнаружена проводимость с энергией активации  $\epsilon'$ , промежуточной по отношению к  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$  — энергиям активации проводимости по нижней (НЗХ) и верхней (ВЗХ) зонам Хаббарда. Результаты объясняются возбуждением электронов НЗХ в «хвост» ВЗХ. Сделан ряд заключений о структуре ВЗХ. Предложено объяснение уменьшения  $\epsilon_3$  с концентрацией примеси  $N$ .

1. В кристаллических полупроводниках проводимость  $\sigma(T)$  можно представить в виде  $\sigma(T) = \sigma_1(T) + \sigma_n(T)$ , где  $\sigma_1(T) = \sigma_{01} \exp(-\epsilon_1/T)$  — проводимость по свободной зоне,  $\sigma_n(T)$  — проводимость по примесям. Наше сообщение посвящено области перехода от  $\sigma_n$  (низкие  $T$ ) к  $\sigma_1$  (высокие  $T$ ) в Si с компенсацией  $K \leq 10^{-4}$ .

Обычно  $\sigma_n(T)$  представляет собой прыжковую проводимость по НЗХ — основным состояниям примеси:  $\sigma_n = \sigma_3$ . При  $T < T_s \simeq \epsilon_3 \ln(K^{-1})^{-1}$   $\sigma_3 = \sigma_{03} \exp(-\epsilon_3/T)$ . Энергия  $\epsilon_3$  определяется положением уровня Ферми  $\epsilon_3 = \epsilon_F = 0.61e^2/\pi R_c$ ;  $R_c = (4\pi N/3)^{-1/3}$ . При  $T \geq T_s$  наступает насыщение:  $\sigma_3 = \sigma_{\text{нас}} = \text{const}$  [1].

Наши измерения показали, однако, что при  $K \simeq 10^{-4}$ — $10^{-5}$  насыщение  $\sigma_3(T)$  выражено очень слабо или отсутствует. Для выяснения причины этого факта мы провели измерения  $\sigma(T)$  и холловского напряжения и обработали результаты по двузонной модели [2]. Это позволило отделить  $\sigma_n$  от  $\sigma_1$  и изучить зависимость  $\sigma_n(T)$  в области, где  $\sigma_n \ll \sigma_1$ .

Оказалось, что в области перехода от  $\sigma_n$  к  $\sigma_1$  существует проводимость с энергией активации  $\epsilon'$  такой, что  $\epsilon_3 < \epsilon' < \epsilon_2$  (об энергии  $\epsilon_2$  см. далее):  $\sigma'(T) = \sigma'_0 \exp(-\epsilon'/T)$  (рис. 1, кривая 1). Она наблюдается как в  $p$ -Si, так и в  $n$ -Si (далее приводятся результаты для  $p$ -типа).

Недавно было обнаружено, что в определенном диапазоне  $N$  и  $K$  вместо  $\epsilon_3$ -проводимости наблюдается моттовская проводимость с переменной длиной прыжка:  $\sigma_n(T) = \sigma_m(T) \sim \exp[-(T_0/T)^{1/4}]$  [3]. В переходной области проводимость  $\sigma'(T)$  существует и в этих образцах (рис. 1, кривая 2).

Максимальные значения  $K$ , при которых наблюдается эта проводимость для образцов с  $\epsilon_3$ -проводимостью, увеличиваются от  $K \simeq 10^{-5}$  при  $N^{-1/3} \simeq 210 \text{ \AA}$  до  $K \simeq 10^{-4}$  при  $N^{-1/3} \simeq 160 \text{ \AA}$ . При  $K \simeq 10^{-5}$  она проявляется в достаточно большом диапазоне  $T$  и без вычитания  $\sigma_1$  из полной проводимости. С ростом  $N$   $\epsilon'$  монотонно уменьшается (в отличие от  $\epsilon_3$ ). В образцах, где  $\sigma_n = \sigma_m(N^{-1/3}) \simeq 280$ — $360 \text{ \AA}$  [3],  $\sigma'(T)$  имеет место при  $K \simeq 10^{-5}$ .

Существование  $\epsilon'$ -проводимости объясняет отсутствие насыщения в образцах с  $\epsilon_3$ -проводимостью. В самом деле, если экстраполировать зависимость  $\sigma'(T)$  в меньшие  $T$  и вычесть  $\sigma'$  из  $\sigma_n$ , то получим насыщение  $\sigma_3(T)$  (рис. 1).

2. Измерения показали, что зависимости  $\sigma'$  и  $\sigma_3$  от  $E$  ( $E < 100 \text{ В/см}$ ) и  $H$  ( $H < 10 \text{ кЭ}$ ) совпадают. Поэтому мы считаем, что  $\sigma'(T)$ , как и  $\sigma_3(T)$ , обусловлена движением вакансий по НЗХ (для  $n$ -типа). Тогда экспоненциальный рост  $\sigma'(T)$  должен быть связан с увеличением числа вакансий. Последнее при  $T \geq T_s$  может происходить за счет активации электронов из НЗХ в какие-то

вышележащие состояния. Это могут быть только состояния, лежащие вблизи дна  $D^-$ -зоны (ВЗХ). Они возникают в случайных скоплениях (клusterах) центров, сближенных на расстояния, меньшие  $R_c$ . Такие клusterы встречаются относительно редко, расстояния между ними велики и эти состояния являются непроводящими.

Энергия  $\epsilon'$  должна быть связана с расстоянием  $\Delta\epsilon$  между НЗХ и дном ВЗХ. Для образцов с  $\epsilon_3$ -проводимостью эта связь довольно очевидна. Концентрация вакансий в истощении равна  $KN$ . В области, где  $\sigma' (T) > \sigma_{\text{нас}}$ , концентрация вакансий должна быть больше  $KN$ . Это означает, что при  $\epsilon'$ -проводимости  $\epsilon_F = \sigma_{\text{нас}}$ , лежит посередине между НЗХ и дном ВЗХ и  $\Delta\epsilon = 2\epsilon'$ . Для образцов, у которых  $\sigma_{\text{нас}} = \sigma_m$ , эта связь менее очевидна. Мы предположили, что в этом случае  $\Delta\epsilon = \epsilon'$ .

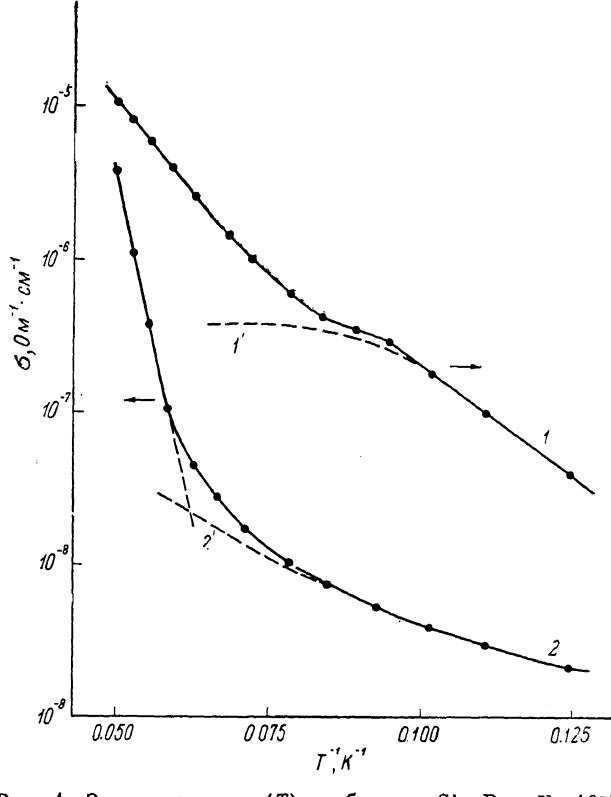


Рис. 1. Зависимости  $\sigma_m (T)$  в образцах Si : B с  $K \approx 10^{-5}$ .

$N, \text{ см}^{-3}$ : 1 —  $1.2 \cdot 10^{17}$ , 2 —  $3.5 \cdot 10^{16}$ ; 1' — насыщение  $\sigma_s (T)$ , 2' — экстраполяция  $\sigma_m (T)$  в область высоких  $T$ .

При этом мы исходили из того, что наличие проводимости  $\sigma_m$  свидетельствует о достаточно высокой плотности состояний вблизи  $\epsilon = \epsilon_F$ . В таком случае эта область должна фиксировать энергию Ферми.

Зависимость  $\Delta\epsilon (N)$ , полученная по описанному выше рецепту из измеренных значений  $\epsilon' (N)$ , показана на рис. 2 (кривая 1). Там же (кривая 1') показана зависимость  $I_1 (N) = \epsilon_i - \Delta\epsilon (N)$  — расстояния между дном ВЗХ и уровнем изолированного  $D^-$ -центра  $\epsilon_i$  ( $\approx 43$  мэВ). Примечательно, что значения  $I_1$  для образцов, существенно различающихся по  $N$  и  $K$  и имеющих различный характер проводимости по примесям в области низких  $T$ , на плоскости  $\ln I_1 - N^{-1/2}$  ложатся на одну прямую. Прямая хорошо аппроксимируется выражением  $I_1 = A_1 \exp(-N^{-1/2}/a_i)$ , где  $a_i$  — радиус  $D^-$ -состояния ( $\approx 95$  Å для Si : B),  $A_1 \approx 150$  мэВ.

3. Известно, что при достаточно больших  $N$  и малых  $K$  наблюдается  $\epsilon_2$ -проводимость, обусловленная движением электронов вблизи порога подвижности ВЗХ. Сопоставим зависимости  $\epsilon_2 (N)$  и  $\Delta\epsilon (N)$ . На рис. 2 приведены значения  $\epsilon_2$ , полученные нами в равновесных и неравновесных [2] условиях, а также данные [4]. Видно, что  $\epsilon_3 < \epsilon' < \epsilon_2$ . Здесь же (кривая 2') показана зависимость

от  $N$  расстояния между уровнем  $\epsilon_i$  и порогом подвижности:  $I_2(N) = \epsilon_i - \epsilon_2(N)$ . Оказывается, что зависимость  $\ln I_2(N)$  от  $N^{-1/3}$  также линейна и описывается выражением:  $I_2(N) = A_2 \exp(-2N^{-1/3}/a_i)$ , причем  $A_2 \approx A_1$ .

Зависимости  $I_1(N)$  и  $I_2(N)$  можно интерпретировать, если формально воспользоваться представлениями Лифшица [5] о резонансных и нерезонансных центрах. «Хвост» ВЗХ обусловлен образованием кластеров из сравнительно небольшого числа центров, причем разброс межцентровых расстояний в кластере  $\Delta R < a_i$ . Это резонансные центры, энергия расщепления уровней в системе таких центров  $I \sim \exp(-R_c/a_i)$ . В формировании же проводимости от

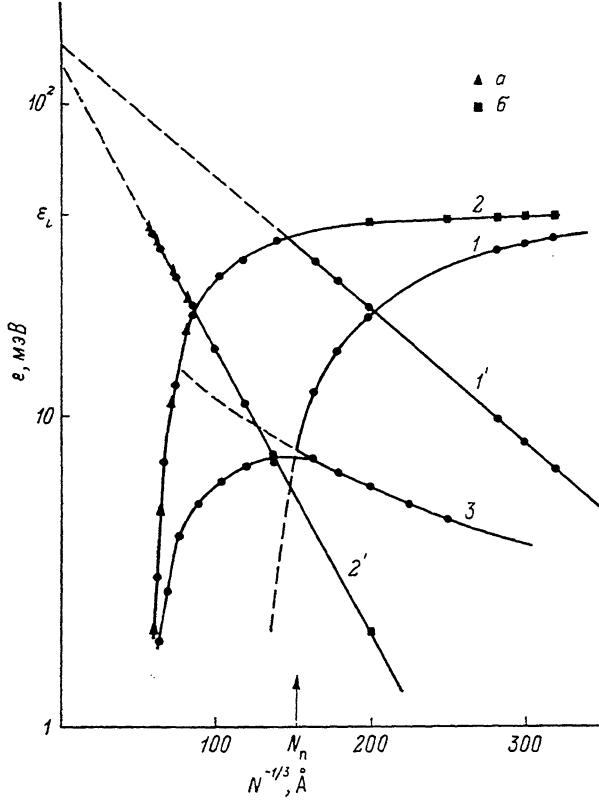


Рис. 2. Зависимости от  $N$ .

1 —  $\Delta\epsilon$ , 2 —  $\epsilon_2$ , 3 —  $\epsilon_3$ , 1' —  $I_1$ , 2' —  $I_2$ . Значения  $\epsilon_i$  по данным [4] (а) и [2] (б).

контакта до контакта по ВЗХ участвует большинство центров, так что  $\Delta R \simeq R_c > a_i$ . Для таких нерезонансных центров  $I \sim \exp(-2R_c/a_i)$ .

Однако модель Лифшица применима для короткодействующих центров при  $R_c \gg a_i$ . Эти условия у нас не выполняются. Тем не менее соответствующие зависимости имеют место. Этот факт представляется нам весьма нетривиальным.

Сопоставляя зависимости  $I_1(N)$  и  $I_2(N)$ , можно сделать вывод, что ВЗХ состоит из относительно слабо размытого пика, где находится край подвижности и длинного хвоста, обязанного своим происхождением глубоким потенциальным ямам, возникающим в местах скоплений примесных центров (рис. 3).

4. Известно, что при увеличении  $N$   $\epsilon_3$  растет, как  $N^{1/3}$ , до некоторого предельного значения  $N \simeq N_u$ , потом начинает уменьшаться (рис. 2, кривая 3). Общепринятого истолкования этого уменьшения нет [1, 6]. Развитая выше модель  $\epsilon'$ -проводимости позволяет дать простое объяснение. Продлив зависимость  $\Delta\epsilon(N)$  (рис. 2, кривая 1) в область малых  $R_c$ , находим, что кривая  $\Delta\epsilon(N)$  пересекается с зависимостью  $\epsilon_3 \sim N^{-1/3}$  как раз при  $N \simeq N_u$ . При  $N > N_u$  дно ВЗХ опустится ниже уровня Ферми  $\epsilon_F$  ( $\simeq \epsilon_3$ ). Это приведет к увеличению плотности состояний вблизи  $\epsilon_F$ , переходу электронов из верхнего

хвоста НЗХ в состояния нижнего хвоста ВЗХ, росту числа вакансий и понижению уровня  $\epsilon_f \simeq \epsilon_3$ . С этой точки зрения, не является неожиданным изменение зависимостей  $\sigma_n$  от  $T$  и  $H$ , наблюдающееся при  $N > N_c$  [1].

Таким образом, исходя из интерпретации, предлагаемой для объяснения полученных результатов, можно заключить, что в некомпенсированных кри-

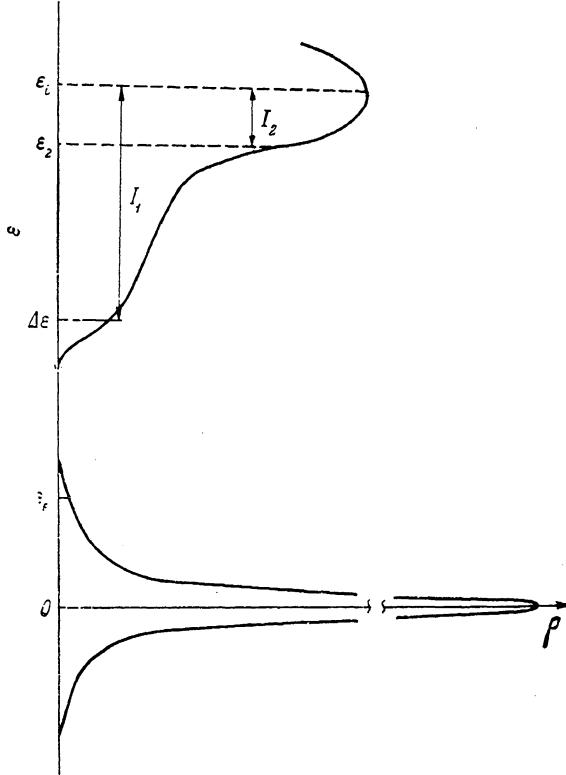


Рис. 3. Схематическое изображение зависимости плотности состояний от энергии  $\rho$  ( $\epsilon$ ) в ВЗХ и НЗХ.

сталлических полупроводниках при малых  $N$  структура ВЗХ соответствует представлениям Мотта—Лифшица. С ростом  $N$  перекрытие зон приводит к перезарядке состояний и увеличению кулоновского разброса. В этом случае более адекватным описанием системы будет модель Андерсона.

#### Список литературы

- [1] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М., 1979. 416 с.
- [2] Ворожцова Л. А., Гершензон Е. М. и др. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. В. 4. С. 1419—1423.
- [3] Гершензон Е. М., Гурвич Ю. А. и др. // Письма ЖЭТФ. 1990. Т. 51. В. 1. С. 204—208.
- [4] Staunton H. F. Thesis Brown Univ. 1970. 400 с.
- [5] Лифшиц И. М. // УФН. 1964. Т. 63. В. 2. С. 618—621.
- [6] Pollak M., Knotek M. L. // Sol. St. Commun. 1977. V. 21. P. 183—186.